**Рубаник, Юрий Тимофеевич. Методы обеспечения надежности изделий микроэлектроники на основе принципов теории управления качеством : автореферат дис. ... доктора технических наук : 05.26.01 / Моск. гос. ин-т электронной техники.- Москва, 1996.- 41 с.: ил. РГБ ОД, 9 97-5/505-X**